



Olympus Hersteller:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.44 Bildfeld (mm):

40.50 Länge ohne Gewinde (mm):

31.00 Max. Durchmesser (mm):

169 Gewicht (g):

## Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):  
Glass: 0 - 1.2mm  
Silicon: 0 - 1.2mm

3.60 Brennweite BW (mm):

50X Vergrößerung:

0.65 Numerische Apertur NA:

0.52 Auflösung ( $\mu\text{m}$ ):

0.65 Tiefenschärfe ( $\mu\text{m}$ ):

Arbeitsabstand (mm):  
Glass: 4.50 - 3.76mm  
Silicon: 4.50 - 4.20mm

400 - 1600 Wellenlängenbereich (nm):

22 Feldzahl:

45 Parfokallänge (mm):

N/A Immersionsflüssigkeit:

4.68 Entrance Pupil Diameter (mm):

## Gewinde & Montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI Gewinde:

## Konformität mit Standards

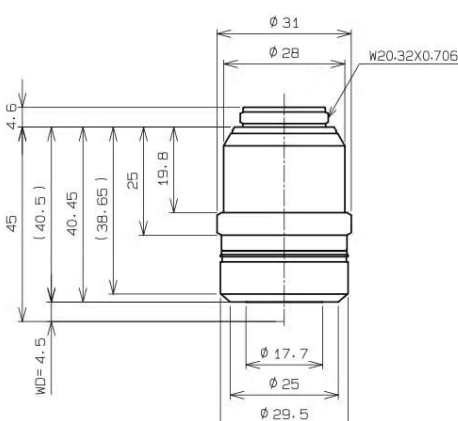
[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

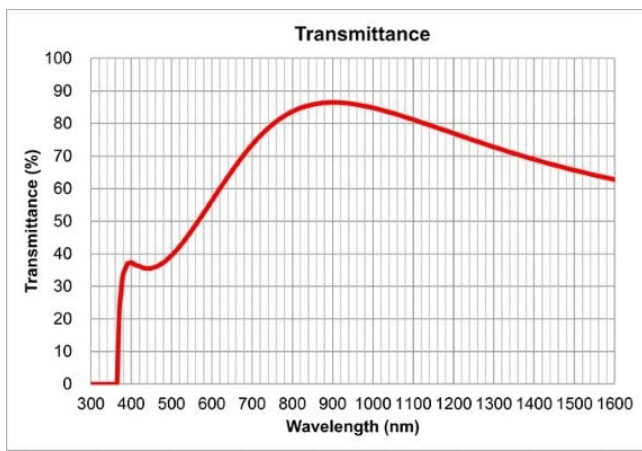
## Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
- Korrekturing zur Anpassung an die Probendicke
- Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubulinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturing, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

## Technische Informationen





LCPLN50XIR Transmission Graph

;